## λ相 Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> エピタキシャル薄膜におけるシード層からの Mg 拡散の効果

Influence of Mg diffusion from seed layer on the stability of λ-Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> epitaxial thin film 東大院理 <sup>○</sup>陳 昊,廣瀬 靖,長谷川 哲也

Univ. of Tokyo °H. Chen, Y. Hirose, T. Hasegawa

E-mail: jingou0203@chem.s.u-tokyo.ac.jp

【はじめに】  $Ti_3O_5$  の準安定相である  $\lambda$ - $Ti_3O_5$  は、熱・光照射・圧力印加などの外場によって高温安定相 の  $\alpha$ - $Ti_3O_5$  や低温安定相の  $\beta$ - $Ti_3O_5$  へと構造相転移し、電気伝導性や光学特性が変化することから、記録材料や蓄熱材料として注目されている[1,2]。  $\lambda$ - $Ti_3O_5$  の合成法としては、 $TiO_2$  を水素中で強還元する方法が一般的に用いられており、その形態はナノ粒子や多結晶薄膜に限られていたが、我々は擬ブルッカイト型  $MgTi_2O_5$  をシード層とすることで $\lambda$ - $Ti_3O_5$  のエピタキシャル成長に成功した[3]。一方、ほぼ同一の条件でエピタキシャル成長した場合でも、 $\lambda$ - $Ti_3O_5$  の単斜晶構造に由来する 203 と 20-3 回折ピークの分裂幅が狭い結晶や、分裂を示さない直方晶の  $\alpha$ - $Ti_3O_5$  の結晶が得られることがあった。本研究では、 $Ti_3O_5$  粉末に Mg をドープすると、ドープ量の増大に伴って室温最安定相が  $\beta$ → $\lambda$ → $\alpha$  相へと変化するという最近

の報告[4]に注目し、 $MgTi_2O_5$  シード層からの Mg 拡散が、 $Ti_3O_5$  薄膜の相安定性に影響を与える可能性を検討した。

【試料作製】試料の合成にはPLD法を用いた。まず、LaAlO3 (110)単結晶基板上に製膜温度 600 °C、酸素分圧  $1\times10^4$  Torr で $MgTi_2O_5$ シード層をエピタキシャル成長した。その後、TiOターゲットを用い、酸素分圧  $2\times10^6$  Torr で $Ti_3O_5$  薄膜を堆積した。 $Ti_3O_5$  薄膜の厚さは 90 nm に固定し、 $MgTi_2O_5$ シード層の厚さ ( $t_{seed}$ )を 1 nm-40 nm の範囲で変えた試料を作製した。

【結果と考察】 XRD 測定により、 $t_{seed} \ge 2$  nmで(100)配向した  $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> のエピタキシャル成長を確認した(Fig. 1a)。 $t_{seed} = 2$  nm では単斜晶構造に起因する 203 と 20-3 回折ピークの明瞭な分裂(2 $\theta$  = 32.3°, 32.9°)がみられたが、 $t_{seed}$ が増加すると分裂幅は減少し、回折角も直方晶の  $\alpha$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> の文献値 (2 $\theta$  = 32.4°)に近づいた(Fig. 1b)。また、SEM-EDX 測定(加速電圧3.0 kV、検出深さ~80 nm)の結果、すべての試料で Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜への Mg の拡散が確認された。Mg/Ti 比を半定量分析した結果、 $t_{seed}$ の増大に伴ってMg/Ti 比が増大し、Mg/Ti~4%( $t_{seed}$  = 20 nm)で飽和した(Fig. 2)。以上より、MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> シード層からTi<sub>3</sub>O<sub>5</sub> 薄膜への Mg 拡散が、 $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>と $\alpha$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub>の相対的な安定性に影響を与えることが分かった。

【参考文献】[1] H. Tokoro *et al.*, Nat. Commun. **6**, 7037 (2015). [2] S. Ohkoshi et al., Nat. Chem. **2**, 539 (2010). [3] 陳他、第 79 回秋季学術講演会, 18p-223-8. [4] M. Wang *et al.*, J Alloy Com. **774**, 1189 (2019).

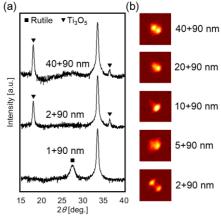


Fig.1 (a)  $\theta$ -2 $\theta$  XRD pattern and (b) 2D images around 20±3 peak of the  $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> thin films grown on the MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> seed layer with various thickness.

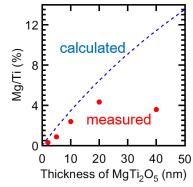


Fig. 2 Mg/Ti ratio of the  $\lambda$ -Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> thin films grown with various  $t_{\text{seed}}$ . The dashed line denotes the value calculated assuming a perfect mixing between the MgTi<sub>2</sub>O<sub>5</sub> and Ti<sub>3</sub>O<sub>5</sub> layers.